# 《微机原理与接口技术》实验指导书

实验四 中断和 ADC

# "微机原理与接口技术"课程教学团队

北京航空航天大学 仪器科学与光电工程学院

2022年11月

## 一、实验目的

- 1.掌握外部中断原理,完成相应实验测试
- 2.掌握 ADC 的配置和使用,完成芯片内部温度的测量

## 二、实验设备

- 1.PC 计算机;
- 2.Keil for ARM(MDK)开发环境 V5.36 及以上;
- 3.NUCLEO 或 Disco 实验平台,主要查看相应的开发板电路图。

## 三、实验内容

- 1. 外部中断,将用户按键配置为外部中断,按键按下,产生中断,执行相应操作。
- 2. ADC 实验,芯片内部有测温传感器,通过 ADC 将内部温度测量量转化为数字量,再通过公式计算出真实温度。
  - 3、拓展实验,自由发挥。

## 四、实验步骤

### 4.1 外部中断

- IO 口外部中断的一般步骤:
- 1) 使能 IO 口时钟。
- 2) 调用函数 HAL\_GPIO\_Init 设置 IO 口模式,触发条件,使能 SYSCFG 时钟以及设置 IO

口与中断线的映射关系。

- 3) 配置中断优先级( NVIC), 并使能中断。
- 4) 在中断服务函数中调用外部中断共用入口函数 HAL GPIO EXTI IRQHandler。
- 5) 编写外部中断回调函数 HAL GPIO EXTI Callback 实现控制逻辑。

用户按键连接在 PC13,下述代码功能是检测用户按键是否按下,如果按下则系统调用回调函数完成相应功能。

#### 1. 配置中断初始化

```
void EXTI15_10_IRQHandler_Config(void)
{
   GPIO_InitTypeDef      GPIO_InitStructure;
```

```
/* Enable GPIOC clock */
     __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();
     /* Configure PC.13 pin as the EXTI input event line in interrupt mode for both CPU1 and
CPU2*/
     GPIO_InitStructure.Mode = GPIO_MODE_IT_RISING;
                                                    /* current CPU (CM7) config
in IT rising */
     GPIO_InitStructure.Pull = GPIO_NOPULL;
     GPIO_InitStructure.Pin = BUTTON_USER_PIN;
     HAL_GPIO_Init(BUTTON_USER_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
     /* Enable and set EXTI lines 15 to 10 Interrupt to the lowest priority */
     HAL_NVIC_SetPriority(EXTI15_10_IRQn, 2, 0); //抢占优先级为 2, 子优先级为 0
     HAL NVIC EnableIRQ(EXTI15 10 IRQn);
                                                 //使能中断线
     /* Configure the second CPU (CM4) EXTI line for IT*/
     HAL_EXTI_D2_EventInputConfig(EXTI_LINE13, EXTI_MODE_IT, ENABLE);
   }
   //中断服务函数
   void EXTI15 10 IRQHandler(void)
   {
     HAL GPIO EXTI IROHandler(BUTTON USER PIN); //调用中断处理公用函数
   }
   2. 编写中断处理回调函数,在函数里编写产生中断后执行的代码,比如翻转 LED。
   void HAL GPIO EXTI Callback(uint16 t GPIO Pin)
     if (GPIO Pin == BUTTON USER PIN)
       //按键按下,产生中断,调用回调函数,编写相应的代码
     }
   3. 主函数程序
```

主函数中调用 EXTI15\_10\_IRQHandler\_Config 即可。完成回调函数编写(自由发挥),观察中断现象。

## 4.2 ADC 实验

#### 1. 初始化 ADC

ADC HandleTypeDef hadc3;

```
static void MX ADC3 Init(void)
     ADC ChannelConfTypeDef sConfig = {0};
     hadc3.Instance = ADC3;
     hadc3.Init.ClockPrescaler = ADC CLOCK ASYNC DIV6;
                                                            //6 分频,
                                                                //16 位分辨
     hadc3.Init.Resolution = ADC RESOLUTION 16B;
率
                                                                    // 非 扫
     hadc3.Init.ScanConvMode = ADC SCAN DISABLE;
描模式
     hadc3.Init.EOCSelection = ADC EOC SINGLE CONV;
                                                                //关闭 EOC
中断
     hadc3.Init.LowPowerAutoWait = DISABLE;
                                                                    // 自 动
低功耗关闭
                                                                // 开启单次
     hadc3.Init.ContinuousConvMode = DISABLE;
转换
     hadc3.Init.NbrOfConversion = 1;
   //1 个转换在规则序列中 也就是只转换规则序列 1
     hadc3.Init.DiscontinuousConvMode = DISABLE;
                                                                //禁止不连
续采样模式
                                                            //软件触发
     hadc3.Init.ExternalTrigConv = ADC SOFTWARE START;
     hadc3.Init.ExternalTrigConvEdge = ADC EXTERNALTRIGCONVEDGE NONE;//使用
软件触发
     hadc3.Init.ConversionDataManagement = ADC CONVERSIONDATA DR;
                                                                     // 规 则
通道的数据仅仅保存在 DR 寄存器里面
     hadc3.Init.Overrun = ADC OVR DATA PRESERVED;
//保存旧数据
     hadc3.Init.LeftBitShift = ADC LEFTBITSHIFT NONE;
                                                                     // 过 采
     hadc3.Init.OversamplingMode = DISABLE;
样关闭
     if (HAL ADC Init(&hadc3) != HAL OK)
       Error Handler();
     sConfig.Channel = ADC CHANNEL TEMPSENSOR;
                                                   //通道,内部测温通道
                                                        //1 个序列
     sConfig.Rank = ADC REGULAR RANK 1;
     sConfig.SamplingTime = ADC SAMPLETIME 810CYCLES 5;//采样时间
     sConfig.SingleDiff = ADC SINGLE ENDED;
                                                 //单边采集
     sConfig.OffsetNumber = ADC OFFSET NONE;
     sConfig.Offset = 0;
     if (HAL ADC ConfigChannel(&hadc3, &sConfig) != HAL OK)
```

#### 2. 主函数程序

MX\_ADC3\_Init();

HAL\_ADCEx\_Calibration\_Start(&hadc3,ADC\_CALIB\_OFFSET,ADC\_SINGLE\_END ED);// ADC 校准

#### 3. 计算真实温度

上述循环中 adc\_v 中的值并不是真实温度值,芯片内部存储着 30 度和 110 度时的校准值:

ts\_cal1=\*(volatile unsigned short\*)(0X1FF1E820); ts\_cal2=\*(volatile unsigned short\*)(0X1FF1E840);

根据公式可求得真实的温度值

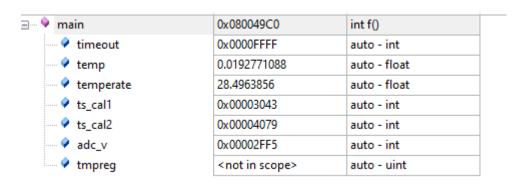
$$T(^{\circ}C) = \frac{110-30}{\text{ts cal2-ts cal1}} *(\text{adc\_v-ts\_cal1}) + 30$$

上式中:

ts\_call 是温度传感器在 30℃时的校准值,固定保存在芯片内部的: 0X1FF1 E820 ~0X1FF1 E821 这两个地址( 16 位)。

ts\_cal2 是温度传感器在 110℃时的校准值,固定保存在芯片内部的: 0X1FF1 E840 ~0X1FF1 E841 这两个地址( 16 位)。

根据上述公式,完成 while 循环的代码,计算出真实温度。完成仿真中的测试如图:

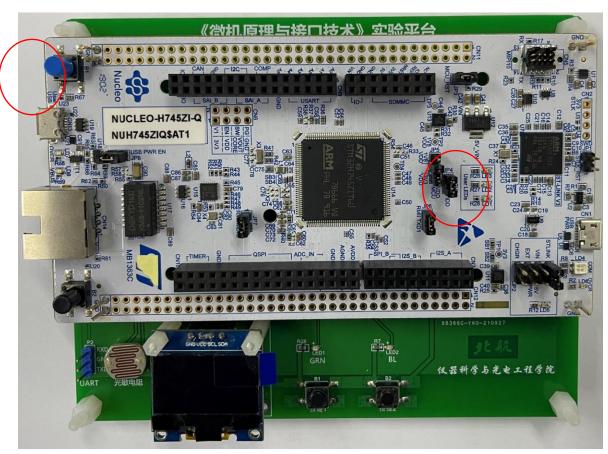


## 4.5 调试程序

调试程序,并完成实验

## 五、参考程序

见之前模板。



实验平台实物照片 (Nucleo)



实验平台实物照片(Disco版)